

AFMミーティング2025

AFMを用いたマイクロ・ナノエレクトロニクスデバイス評価技術

セミナー参加特典

**プローブ 25%OFF
クーポンプレゼント!**

その他レクリエーションで当たる
豪華賞品をご用意!!

本ミーティングでは、EUV、電子デバイス、パワーデバイス半導体、不良・欠陥解析をトピックスとしたAFM、AFM-IR評価事例や、磁気抵抗効果素子の評価などによる技術動向や事例をご紹介します。ブルカーからはAFM、AFM-IRの最新評価技術をご紹介します。また、参加特典として、ブルカープローブ25%OFFクーポンをプレゼント致します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

◆ 開催概要

日時：2025年3月25日（火） 13:00-17:00（12:30 受付開始）

会場：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501号室

(https://abc-kaigishitsu.com/tokyo_yaesudori/yaesudori.html)

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル 5階

JR東京駅（八重洲口）より徒歩約10分、日比谷線 八丁堀駅より徒歩2分。

定員：60名

費用：無料（事前登録制）

申込み：左記登録サイトよりお申し込み下さい

▼登録フォーム



登録フォーム ▶ <https://bit.ly/4hPSWIg>

◆ プログラム

開始	終了	内容	講演者
13:00	13:10	オープニング	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 統括部長 鈴木 大輔
13:10	14:00	『ナノデバイスの物性・信頼性研究におけるAFM活用事例とEUV世代での期待』	九州大学大学院システム情報科学研究院 教授 近藤 博基 様
14:00	14:50	『パワーデバイス用SiC半導体における欠陥制御ーSiC結晶成長表面の観察を通してー』	関西学院大学 工学部 教授 大谷 昇 様
		休憩（レクリエーション、交流） 簡単なお茶とお菓子を用意しております。参加者の皆様での情報交換の機会としていただければ幸いです。	
15:20	15:45	『CIPT(Current In-Plane Tunneling)測定を用いた磁気抵抗効果素子評価・SmartCoat ®高分解能MFMプローブについて』	巴工業株式会社 機能材料部 小林 昭史 様
15:45	16:10	『AFMを用いたエレクトロデバイスの評価』	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 寺山 剛司
16:10	16:35	『<5nmの水平分解能を達成するAFM-IRの最新技術』	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 横川 雅俊
16:40	16:55	クロージング・ご案内	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 営業部 荒尾 昌樹

セミナー参加者特典

● 参加者全員にもれなく
**プローブ25%OFF
クーポン プレゼント**



その他豪華景品がゲットできるイベントを企画し、皆様のご参加をお待ちしております。

参加登録はこちら▶

<https://bit.ly/4hPSWIg>